



電子基板の防湿コーティング欠陥検査装置

電子基板上に塗布された防湿コーティング膜の塗りムラを高精細撮像し、検査いたします。

特徴

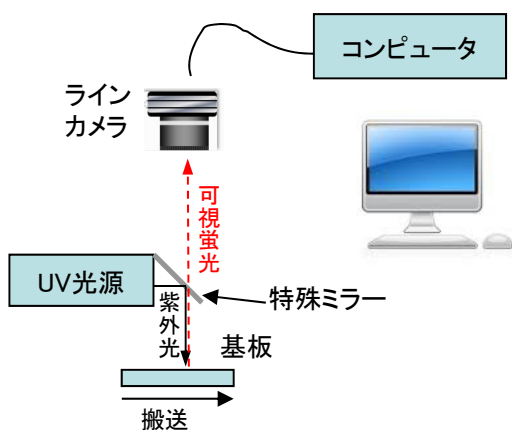
● 電子基板上の防湿コート

電子基板は耐環境性を高めるために防湿コーティングが施される場合があります。防湿コーティングが均一になされているかを検査することにより、基板の信頼性を高めることができます。

● 紫外励起蛍光法による防湿コートの可視化

防湿コーティング素材の紫外励起蛍光発光特性を利用して、コーティング状態を可視化します。電子基板にはコンデンサやチップなどの立体物が装着されていますが、紫外照明とカメラ光軸を一致させた「影」のできにくい光学系により検査不能領域を最小化しています。

機器構成



画像例

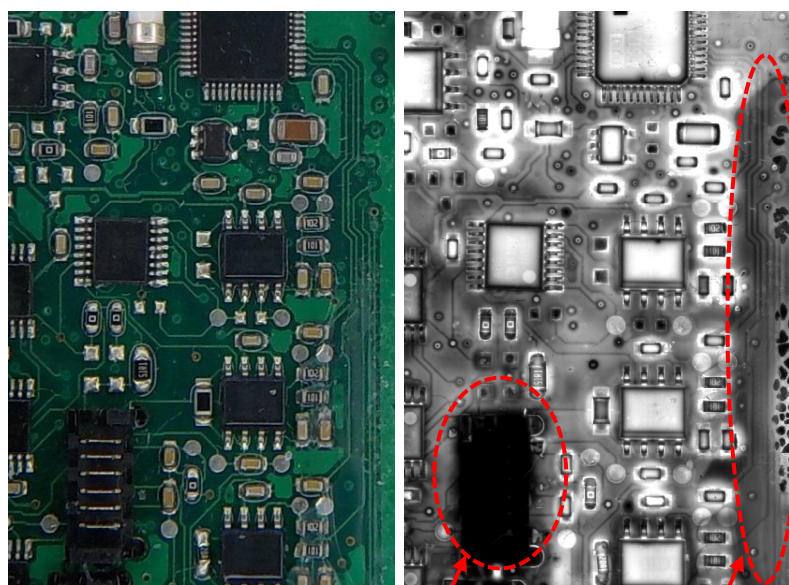


図2 通常画像

図3 蛍光画像

塗布後に部品を実装 溶剤で塗膜を剥離
(塗り残し模擬) (塗りムラ模擬)

● 仕様例

- 基板サイズ : ~250x250mm
- 搬送速度 : ~300mm/s
- 解像度 : 800dpi (32 μm/画素)

● 構成／特徴

- 照明系: 特殊ミラーの採用によるカメラと紫外光源の光軸を一致させ、凹凸部品による「照明の影」をなくしました。
- 撮像系: 8000画素ラインカメラによる高精細撮像を行います。
- 処理系: Windows汎用計算機を用いて、お客様のご要求に沿い、カスタマイズされた検査処理システムをご提供いたします。

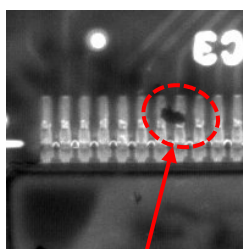


図4 微小異物欠陥画像例

● 検査画像例

肉眼では確認しにくいコーティングの塗りムラや微細な異物・コーティング欠けなどを蛍光画像により捉えることが可能です。

適用例

- 電子基板上の防湿コーティング検査
- その他の紫外により蛍光発光する薄膜の均一性検査



JFE テクノリサーチ 株式会社

<http://www.jfe-tec.co.jp>

0120-643-777

Copyright ©2015 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。